

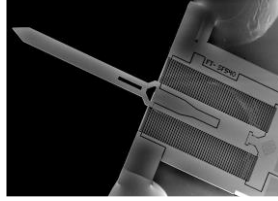
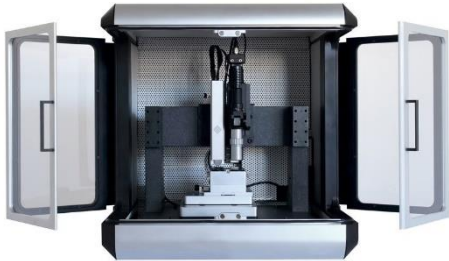
ナノインデントー & ひずみ解析ソフトウェア



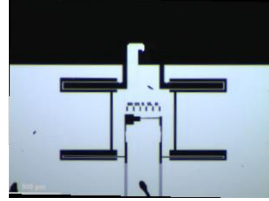
■ FT-I04

超高精度単体機ナノインデントー

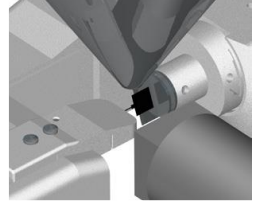
New!!



MEMS荷重センサー

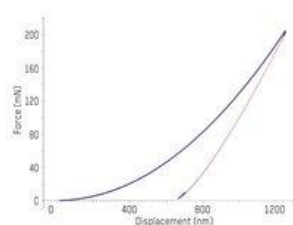


FT-TT02(引張用MEMS)



リアルタイムEBSD

FT-I04/NMT04はMEMS荷重センサーとピエゾスキャナーを備えた全く新しいナノインデントーです。完全独立の変位・荷重制御機構は従来方式では不可能であった『真の変位制御』を可能にし、発振や変位制御遅延の心配もありません。50pm、0.5nNの極小ノイズフロアは数nmの極浅インデント評価も可能にします。単体機のFT-I04は材料から部品まで多様なサンプルに、SEM用FT-NMT04はリアルタイムSTEM/EBSDにも対応致します。



荷重-変位曲線

■ FT-NMT04

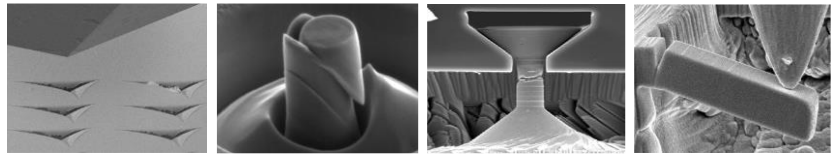
超高精度SEM用ナノインデントー

New!!



共通仕様

- ・変位ノイズフロア: 50pm @10Hz
- ・荷重ノイズフロア: 0.5nN @10Hz
- ・最大荷重: 200mN
- ・サンプルステージ分解能: 1nm
- ・CSM試験 (500Hz)
- ・800°C加熱 (オプション)
- ・2軸スクラッチ試験 (オプション)
- ・電気試験 (オプション)

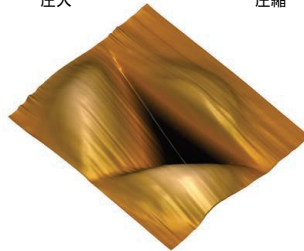


圧入

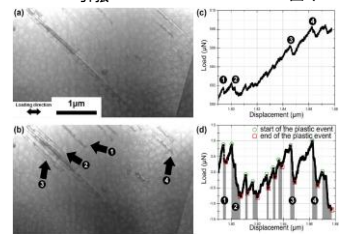
圧縮

引張

曲げ



インデント試験 (SPM画像)



引張試験データ

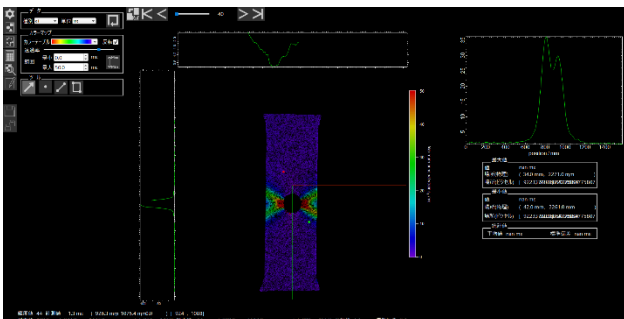
■ sDIC (2D/3D)

DICひずみ解析ソフトウェア

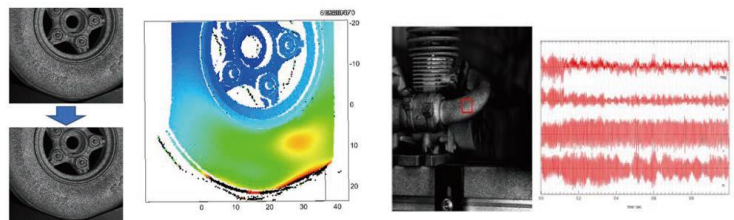
New!!

Seika Digital Image

『sDIC』はDIC (Digital Image Correlation/デジタル画像相関法)を用いた高精度ひずみ解析ソフトウェアです。変形前後の画像から最大1/100ピクセルの分解能で変形・ひずみを解析します。



sDICソフトウェア画面



視差角をつけたペア画像を用いる事により奥行き方向の情報を含んだ3D評価や、連続画像・動画を用いる事により振動等の動的評価も可能です。SEM画像から建築物まで様々なスケールのひずみ解析に対応致します。

※対応OS: Windows10(64bit)
※他、専用カメラシステムも御座います。

Seika Digital Image

西華デジタルイメージ株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂4-9-6 タク赤坂ビル
TEL 03-3405-1288
URL www.seika-di.com
Email info@seika-di.com